М. Е. КАЛИБЕРДА, канд. физ.-мат. наук, С. А. ПОГАРСКИЙ, д-р физ.-мат. наук

ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ ВОЛНЫ НА ДВУХ ГРАФЕНОВЫХ ПОЛОСКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЯХ

Введение

Графеновые решетки в терагерцовом диапазоне длин волн привлекают внимание исследователей ввиду того, что они являются относительно легко создаваемыми элементами плазмонных волноводов, антенн и сенсоров [1 – 8]. При помощи статического электрического поля удается управлять химическим потенциалом одиночных лент и, следовательно, менять характеристики всей решетки в целом.

Графеновые ленты могут рассматриваться как импедансные поверхности. Для определения проводимости лент может быть использована формула Кубо [9].

В работе для исследования решетки, состоящей из двух графеновых лент, лежащих в параллельных плоскостях, предлагается операторный метод [10 – 12]. При его применении необходимо знать операторы отражения и прохождения одиночной ленты. Они найдены методом гиперсингулярных интегральных уравнений [5, 6]. В дальнейшем предполагается развитие метода на конечную и полубесконечную систему графеновых лент, а также на периодическую бесконечную систему со сбоем периодичности [13].

Постановка задачи

Расположим первую графеновую ленту в плоскости z = 0, а вторую – в плоскости z = -h. Смещение лент друг относительно друга вдоль оси *Оу* обозначим как Δ , l – расстояние между лентами. Предполагается, что ленты имеют одинаковую ширину 2d. Геометрия структуры представлена на рис. 1.

Предполагаем, что на решетку падает плоская H - поляризованная электромагнитная волна из области z > 0 под углом φ_0 к оси Oy

$$H_x^i(y,z) = q(\cos\varphi_0) \exp(ik(y\cos\varphi_0 - z\sin\varphi_0)),$$

где φ_0 – угол падения, отсчитываемый от отрицательного направления оси Oy.



Рис. 1

Тогда спектральные функции отраженного $a(\xi)$ и прошедшего $d(\xi)$ поля, а также поля между лентами $C(\xi)$, $B(\xi)$ могут быть найдены из операторных уравнений [10]

$$a = rq + tes^{-}B, \tag{1}$$

$$C = tq + res^{-}B, \tag{2}$$

$$B = res^+C, (3)$$

$$D = tes^+C, \tag{4}$$

где r и t – операторы отражения и прохождения одиночной графеновой ленты. Оператор e определяет изменение амплитуды поля при смещении системы координат вдоль оси Oz на величину h в направлении распространения поля, а операторы s^{\pm} определяют изменение амплитуды поля при смещении системы координат на величину Δ в положительном или отрицательном направлении оси Oy.

Характеристики рассеяния

Введем коэффициенты отражения и прохождения как отношение усредненного потока энергии волны, рассеянной или прошедшей сквозь решетку к усредненному по времени потоку энергии плоской волны, падающей на решетку. Для падающей волны единичной амплитуды, $q(\xi) \equiv 1$, коэффициенты имеют вид

$$|r|^{2} = \frac{\pi\zeta}{2kd\sin\varphi_{0}} \int_{-1}^{1} |a(\xi)|^{2} \sqrt{1-\xi^{2}} d\xi,$$
$$|t|^{2} = 1 + \frac{\pi\zeta}{2kd\sin\varphi_{0}} \int_{-1}^{1} |D_{1}(\xi)|^{2} \sqrt{1-\xi^{2}} d\xi + \frac{\pi\zeta}{kd} \operatorname{Re}(D_{1}(-\cos\varphi_{0})),$$

где $D_1(\xi)$ – спектральная функция прошедшего поля без учета падающей волны,

$$D(\xi) = D_1(\xi) + \delta(\xi - \cos\varphi_0),$$

 $\zeta = 2d/l$ – относительная ширина ленты. Закон сохранения энергии имеет вид

$$|r|^{2} + |t|^{2} + |A|^{2} = 1$$
,

где А – коэффициент поглощения графеновых лент.

Полное сечение рассеяния может быть вычислено по формуле

$$TSCS = \frac{2\pi}{k} \left(\int_{-1}^{1} |a(\xi)|^2 \sqrt{1 - \xi^2} d\xi + \int_{-1}^{1} |D_1(\xi)|^2 \sqrt{1 - \xi^2} d\xi \right).$$

Численные результаты

Прежде всего, необходимо провести верификацию результатов. Для этого сравним результаты, полученные методом гиперсингулярных интегральных уравнений [5, 6] с результатами, полученными предложенным методом для двух лент, лежащих в одной плоскости, т.е. при h = 0. При дискретизации (1) – (4) бесконечный отрезок интегрирования заменялся конечным [-a;a]. Обозначим N – количество узлов в квадратурной формуле при дискретизации (1) – (4). На рис. 2, 3 представлены зависимости полного сечения рассеяния *TSCS* и коэффициента поглощения A при различных значениях a и N от частоты f. Маркерами обозначены результаты, полученные методом гиперсингулярных интегральных уравнений (обозначение – ГСИУ). Наблюдается совпадение результатов с графической точностью при ka = 20 и N = 61 вплоть до частоты в 5.5 ТГц, что позволяет судить о верности



Рис. 2





построенной модели. Параметры структуры: d = 10 мкм, $\Delta = l = 70$ мкм, h = 0, время релаксации $\tau = 10$ пс, химический $\mu = 0.13 \, \text{eB},$ потенциал температура $T = 300 \, \text{K}.$ Наблюдается рост TSCS $f \approx 1.54$, 3.07, 4.04, вблизи частот 4.82 ТГц, которые соответствуют первым четырем резонансам поверхностных плазмонов для одиночной графеновой ленты. Наблюдается рост поглощения энергии падающего поля лентами вблизи частот плазмонных резонансов. Распределение модуля полного поля в ближней зоне возле лент представлено на рис. 4 для резонансной частоты f = 4.04 ТГц.

На рис. 5, 6 представлены зависимости полного сечения рассеяния *TSCS* и коэффициента поглощения A от частоты f для решетки, у которой ленты смещены вдоль оси Oz, $\Delta = h = 45.5$ мкм. Остальные параметры выбраны такими же, как и для рис. 2. Для сравнения также приведены зависимости при h = 0, $\Delta = l = 70$ мкм (пунктирная кривая). В случае, когда присутствует смещение у лент в вертикальной плоскости, значение *TSCS* на частоте первого плазмонного резонанса становится несколько меньше, на частоте второго резонанса – несколько больше. Поглощение же вблизи первого резонанса примерно на 15 % больше у такой решетки.



ISSN 0485-8972 Радиотехника. 2017. Вып. 188



На рис. 7 представлены нормированные диаграммы направленности отраженного ($\varphi \in (0; 180^\circ)$) и прошедшего ($\phi \in (180^{\circ}; 360^{\circ})$) поля для решетки с h = 0(пунктирная кривая) И h = 45.5 мкм, $\Delta = l = 70$ мкм (сплошная кривая) для f = 4.04 ТГц. Остальные параметры выбраны такими же, как и для предыдущих случаев. Наблюдается смещение главного лепестка относительно нормали. Возможность управления углом наклона главного лепестка известна для так называемых решеток

типа жалюзи, у которых ленты лежат в параллельных плоскостях [12, 14]. Таким образом, происходит перенаправление энергии падающей волны в сторону от облучателя.

Выводы

В работе с использованием операторного метода исследованы электродинамические характеристики двух графеновых полосок, лежащих в параллельных плоскостях, в терагерцовом диапазоне длин волн. Проведено сравнение с результатами, полученными методом гиперсингулярных интегральных уравнений для случая, когда ленты лежат в одной плоскости. Совпадение результатов позволяет сделать вывод об их достоверности. Формализм процедуры записи операторных уравнений позволит в будущем рассмотреть конечную и полубесконечную графеновую решетку. Указано на возможность перенаправлять энергию падающей волны в сторону от облучателя при смещении лент в параллельных плоскостях, что вместе со свойством графеновых лент частично поглощать энергию падающей волны может сделать такие многоленточные решетки эффективными в стелс-технологиях.

Список литературы 1. Jablan, M., Buljan, H., Soljacic, M. Plasmonics in graphene at infrared frequencies // Phys. Rev. B. - 2009. - Vol. 80. - P.245435. 2. Bludov, Y. V., Vasilevskiy, M. I., Peres, N. M. R. Mechanism for graphenebased optoelectronic switches by tuning surface plasmon-polaritons in monolayer graphene // European Phys. Lett. -2010. – Vol. 92. – P.68001. 3. *Fallahi, A., Perruisseau-Carrier, J.* Design of tunable biperiodic graphene metasurfaces // Phys. Rev. B. – 2012. – Vol. 86. – P.195408-(9). 4. *Jornet, J. M., Akyildiz, I. F.* Graphene-based Plasmonic Nano-Antenna for Terahertz Band Communication in Nanonetworks // IEEE Journal on Selected Areas in Communications/Supplement. - 2013. - Vol.31. - No.12. - P.685-694. 5. Shapoval, O. V., Gomez-Diaz, J. S., Perruisseau-Carrier, J., Mosig, J. R., Nosich, A. I. Integral Equation Analysis of Plane Wave Scattering by Coplanar Graphene-Strip Gratings in the THz Range // IEEE Trans. Antennas Propag. – 2013. – Vol. 3. No.5. – P.666-674. 6. Balaban, M. V., Shapoval, O. V., Nosich, A. I. THz wave scattering by a graphene strip and a disk in the free space: integral equation analysis and surface plasmon resonances // Journal of Optics. – 2013. – Vol. 15. – Р.1-9. 7. Голованов, О. А., Макеева, Г. С., Варе-ница, В. В. Электродинамический расчет коэффициентов прохождения тем-волны через многослойные периодические структуры графен-диэлектрик в терагерцовом диапазоне // Изв. вузов. Поволжский регион. Физико-математические науки. – 2014. – Т.32. № 4. – С. 108-122. 8. *Макеева, Г. С., Голованов, О. А.* Электродинамиче-ский расчет комплексного коэффициента распространения электромагнитной волны в волноведущей структуре «углеродная нанотрубка – графен» в терагерцовом и инфракрасном диапазонах // Изв. вузов. Поволжский ре-«углеродная нанотруока – графен» в терагерцовом и инфракрасном диапазонах // изв. вузов. поволжскии ре-гион. Физико-математические науки. – 2015. – Т.33. № 1. – С. 140-155. 9. *Hanson, G. W.* Dyadic Green's functions for an anisotropic, non-local model of biased graphene // IEEE Trans. Antennas Propag. – 2008. – Vol. 56. – No. 3. P. – 747-757. 10. *Литвиненко, Л. Н., Просвириин, С.Л.* Спектральные операторы рассяяния в задачах дифракции волн на плоских экранах. – Киев : Наук. думка, 1984. 240 с. 11. *Kaliberda, M. E., Lytvynenko, L. N., Pogarsky, S. A.* Diffraction of H-polarized electromagnetic waves by a multi-element planar semi-infinite grating // Telecommunications and Radio Engineering. – 2015. – Vol. 74. No. 9. – P. 753-767. 12. *Lytvynenko, L. M., Kaliberda, M. E., Pogarsky, S. A.* Wave diffraction by semi-infinite venetian blind type grating // IEEE Trans. Antennas Propag. – 2013. – Vol. 61. No. 12. – P. 6120-6127. 13. *Kaliberda, M. E., Lytvynenko, L. M, Pogarsky, S. A.* Singular Integral Equations in Diffraction Problem by an Infinite Periodic Strip Grating with One Strip Removed // J. Electromagn. Waves Appl. 2016 (online). DOI: 10.1080/09205071.2016.1254071. 14. Шестопалов, В. П., Литвиненко, Л. Н., Масалов С. А., Солосуб, В. Г. Дифракция волн на решетках. – Харьков : ХГУ, 1973. 287 с.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Поступила в редколлегию 25.01.2017